



Programa de Pós-Graduação em Metrologia

Área de Concentração:
Metrologia para Qualidade e Inovação

Ementa de Disciplina



Disciplina	Fundamentos da Tecnologia Industrial Básica
Código	MQI 2002
Responsável	Maurício Nogueira Frota
Tipo da Disciplina	Disciplina Obrigatória para o Mestrado em Metrologia
Número de créditos	03 créditos
Carga horária	03 horas semanais
Objetivo(s)	<ol style="list-style-type: none">1. Nivelar conhecimentos básicos sobre as funções da tecnologia industrial. Notadamente aqueles que integram a infraestrutura nacional da qualidade e impactam no reconhecimento mútuo de resultados de medição, certificados de calibração e relatórios de ensaios.2. Capacitar o mestrando para acesso à literatura especializada internacional sobre questões essenciais relacionadas ao comércio internacional e redução de barreiras técnicas ao comércio.
Conteúdo programático	Fundamentos e conceitos básicos de C&T. Fundamentos da tecnologia industrial (metrologia, normalização, regulamentação técnica, credenciamento, avaliação da conformidade, propriedade intelectual e industrial e tecnologias de gestão). A Estrutura das Organizações de C&T no Brasil e a estrutura das organizações internacionais atuantes em metrologia e áreas afins. Normalização voluntária e regulamentação técnica (normalização compulsória). Avaliação da conformidade (certificação, ensaios, etiquetagem) nos campos regulados (compulsório) e voluntário. Fundamentos da Transferência de Tecnologia. Avaliação Tecnológica na Empresa. Propriedade Intelectual (Marcas e Patentes).
Dinâmica do curso	<ol style="list-style-type: none">1. <u>Aulas teóricas</u>. Apresentação dos conteúdos e discussão em sala de aula com indicação de leitura prévia e preparação de resenha crítica por parte dos mestrandos.2. <u>Aulas práticas</u>. Desenvolvimento de estudo de caso sobre tópicos de interesse da disciplina. Visitas técnicas a instituições afins.
Avaliação	Participação presencial obrigatória em pelo menos 75% das aulas; apresentação de seminários e prova final de avaliação do aprendizado.
Bibliografia principal	<ol style="list-style-type: none">1. Lawrence R.Z. (Coord, Harvard University). The Global Enabling Trade Report 2010. Centre for Global Competitiveness and Performance. World Economic Forum Published 19 May 2010.2. Schooley J.F. (coord). <i>Responding to National Needs</i>, Publication of the National Institute of Standards and Technology (NIST/USA), 2000.3. OECD publication. Standards and conformity assessment in trade: minimizing barriers and maximizing benefits. Policy Dialogue. Nov 2005.4. OCDE. <i>Manual de Oslo</i>. Tradução da FINEP. 3ª. Edição. 2006. World Trade Report. Exploring the links between trade, standards and the WTO. 2005.
Bibliografia complementar	<ol style="list-style-type: none">5. DIAS, José Luciano de Mattos. Medida, normalização e qualidade; aspectos históricos da metrologia no Brasil. Rio de Janeiro: INMETRO e Fundação Getúlio Vargas, Ilustrações, 292 p., CDU: 389.1:001.12(81), 1998.6. Publicações periódicas disponíveis: Metrologia (The Journal of the International Organization of Weights and Measures, BIPM); Publicações das organizações internacionais de Metrologia (BIPM, OIML), Normalização (ISO) e Acreditação (ILAC e IAF) disponíveis nas páginas web dessas organizações internacionais.7. Publicações disponíveis via: home Metrology web-citation-index.